

R100: I-V電性量測針座平台及四點探針量測

服務項目	I-V電性量測針座平台及四點探針量測
使用儀器	Keithley 2440、Keithley 6430
檢測方法	I-V電性量測針座平台及四點探針量測標準操作 程序
<p><b>服務範圍(內容)</b></p>	<p>量測薄膜的暗導值(dark I/V)及片電阻值。</p> <p>使用Keithley 6430 source meter+preamp和四點探針平台，6430特性0.4fA p-p(4E-16A)雜訊、遠端訊號放大器可放置在信號源旁以減少導線雜訊。電壓量測時，大於1016Ω的輸入阻抗，快速量測速度，最大可至每秒2000個讀數，最大可至6位半的解析度，可程式化的數位I/O及介面可加快自動化量測。</p>